Se	arch	Note	S

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination		
10/761,625	PAN ET AL.		
Examiner	Art Unit		
Tuan H. Nguyen	2618		

SEARCHED				
	SEAR	CHED	1	
Class	Subclass	Date	Examiner	
455	69, 116	4/26/2006	T.N	
455	127.2	4/26/2006	T.N	
455	127.3	4/26/2006	T.N	
455	291, 522	4/26/2006	T.N	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		•	

4/26/2006	EXMR T.N
<b>4/</b> 26/2006	T.N
_	
	: